(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年2 月10 日 (10.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/013346 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/306

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/010808

(22) 国際出願日:

2004年7月29日(29.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-204248 2003年7月31日(31.07.2003) JP

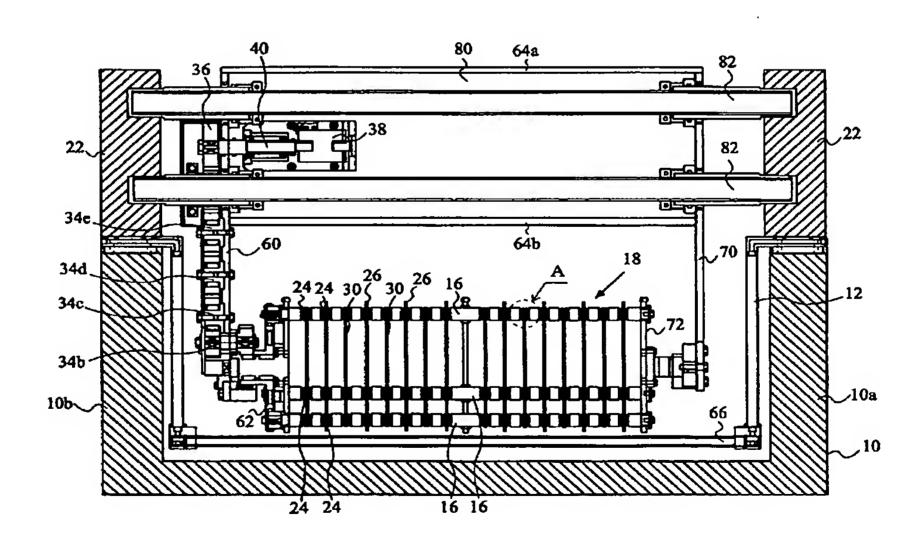
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): コマツ電子金属株式会社 (KOMATSU DENSHI KINZOKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮 3 丁目 2 5 番 1 号 Kanagawa (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宮崎 正光 (MIYAZAKI, Tadamitsu) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP). 平山 和也 (HIRAYAMA, Kazuya) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP). 福永寿也 (FUKUNAGA, Hisaya) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP). 二村 公康(FUTAMURA, Hiroyasu) [JP/JP]; 〒2540014 神奈川県平塚市四之宮3丁目25番1号コマツ電子金属株式会社内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 木村 高久, 外(KIMURA, Takahisa et al.); 〒 1040043 東京都中央区湊 1 丁目 8 番 1 1 号 千代ビル 6 階 Tokyo (JP).

/続葉有/

(54) Title: METHOD AND APPARATUS FOR ETCHING DISK-LIKE MEMBER

(54) 発明の名称: 円板状部材のエッチング方法及び装置



(57) Abstract: Disclosed are a method and apparatus for etching disk-like members, especially a method and apparatus for etching semiconductor wafers. In a method wherein wafers (30) are rotated and etched in an etching chamber (12) which is filled with an etching solution, a non-rotating cell plate (26) is disposed between two rotating wafers (30). In an etching apparatus wherein multiple wafers (30) are supported and rotated by a rod (16), a cell plate (26) is disposed between each two wafers (30). The cell plate (26) has a surface area roughly equivalent to that of the wafer (30).

(57) 要約: 本願発明は、円板状の部材のエッチング方法及びエッチング装置に係り、特に、半導体ウェーハのエッチング方法及びエッチング装置に関する。 エッチング液を満たしたエッチング槽(12)の内部で、ウェーハ(

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), $\exists -\Box \gamma / \zeta$ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。